



[Musterdokument](#) [Datenbankstruktur](#) [Suchhinweise](#) [Suchhilfen](#)

TEMA

TEMA® Technik und Management

Die Datenbank liefert bibliographische Hinweise mit Abstracts auf die deutsche und internationale Fachliteratur. TEMA informiert über die gesamte Breite der Technik und vermittelt umfassend Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung, gibt Hinweise auf neue innovative Entwicklungen sowie auf praxisorientierte Beschreibungen neuer Produkte und Verfahren. Sie verweist auf fast 4 Mio. Fachveröffentlichungen seit 1968. Die Datenbank ist zweisprachig. Sie beinhaltet deutsch- und englischsprachige Abstracts. Gesucht werden kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Das Suchergebnis verbessert sich, wenn sehr spezielle Suchwörter sowohl in Deutsch als auch in Englisch eingegeben werden. Die Datenbank ist zeitlich strukturiert:

- TEMA beinhaltet die Fachliteratur von 1988 bis heute (2.300.000 Dokumente)
- TE87 TEMA-Archiv von 1968 bis 1987 (1.600.000 Dokumente)

Inhalt

Die folgenden auch einzeln aufrufbaren Datenbanken sind Teil der TEMA:

- DOMA Maschinen- und Anlagenbau
- ZDEE Elektrotechnik und Elektronik
- WEMA Werkstoffe
- TOGA Textil
- MEDI Medizinische Technik
- BEFO Betriebsführung und Betriebsorganisation
- BERG Bergbau
- ETEC Energietechnik

Quellen

- Fachzeitschriften
- Konferenzberichte
- Forschungsberichte
- Bücher
- Dissertationen

Suchsprache

Deutsch, englisch

Datenbestand

Zeitraum:	1968 bis heute
Aktualisierung:	wöchentlich
Gesamtbestand (01/2008):	3.900.000 Dokumente
Jährlicher Zuwachs:	130.000 Dokumente

Datenbanktyp

Fachliteratur

Volltexte

Literaturbeschaffung:
Alle Dokumente können direkt aus der Anzeige heraus online via TIBORDER bei der Technischen Informationsbibliothek (TIB), Hannover, bestellt werden. Bei kundenspezifischen Portalen können individuelle Bestellwege vorhanden sein.

Produzent

FIZ Technik e.V.
Hanauer Landstr. 151-153
D-60314 Frankfurt/Main
Tel.: (069) 4308-111
Fax.: (069) 4308-200
E-Mail: kundenberatung@fiz-technik.de
Internet: <http://www.fiz-technik.de>

Musterdokument**Zugriffsnummer**

2061753, TEMA , 23.01.06; Words: 645

Datenbank

TEMA, Copyright FIZ Technik e.V.

Titel

Status and trends in modern micro- and nanotechnology.
Aktueller Stand und Trends in der modernen Mikro- und Nanotechnologie

Abstract

Die jüngste Entwicklung von der Mikro- zur Nanotechnologie bringt neue Ideen und neue physikalische Effekte hervor, welche sowohl in konventionellen als auch in neuartigen Bauteilen verwertet werden können. Beispiele sich schnell

entwickelnder Felder sind in diesem Zusammenhang elektronische, photonische und magnetische Komponenten für Sensor-, Speicher- und Logikanwendungen. Die optische Lithographie als der traditionelle Weg zur Nanostrukturierung wird erweitert durch anspruchsvollere Methoden für den Zugang zur Nanowelt. Schließlich werden Quantencomputer oder molekulare Elektronik Wirklichkeit.

The recent development from micro- to nanotechnology enables new ideas and new physical effects to be implemented in both conventional and novel devices. Examples of fast developing fields in this context are electronic, photonic and magnetic components for sensor, memory, and logic applications. Optical lithography, the traditional path of patterning, is supplemented with sophisticated methods to access the nanoworld. At the end of the road, however, new developments like quantum computing or molecular electronics, which are still in its infancy today, will become reality.

Autor

Brückl-Hubert; Hainberger-Rainer; Heer-Rudolf; Köck-Anton

Institution

ARC Seibersdorf Research, Wien, AT

Quelle

e & i. Elektrotechnik und Informationstechnik * Band 122 (2005) Heft 12, Seite 442-445 (4 Seiten, 2 Bilder, 31 Quellen)

Publikationscodes

ISSN 0932-383X

CODEN: EIEIEE

JC=0360

Sprache

EN Englisch

Standort

TIB-ZS3878/LeltZ1B

Dokumentnummer

200601 02006

Themenbehandlung

A Anwendungsspezifische Abhandlung

Fachgebiete

3FF *Herstellungstechnolog. f. elektron. Bauelemente/ Schaltungen*

3IL *Sensorik, Aktorik*

Deskriptoren

Elektronenstrahlolithographie; Elektrooptik; Forschung-und-Entwicklung; Forschungsaktivität; Forschungsinstitut; FRAM-Speicher; Laser; Mikrobearbeitung; Mikroelektronik; Mikrooptik; Mikrosystemtechnik; Mikrotechnik; Molekularelektronik; MRAM-Speicher; Nanodraht; Nanoelektronik; Nanolithographie; Nanometerbereich;

Nanostruktur; Nanotechnologie;
NEMS=nanoelektromechanischer-Speicher; NFGM-Speicher;
optische-Datenübertragung; Österreich; Photophysik;
Quantenelektronik; Sensorik; Stand-der-Technik; technische-
Entwicklung; Trend=Entwicklung

Dokumentart

JL Zeitschriftenaufsatz (J)

Erscheinungsjahr

2005

Update

20060123

Datenbankstruktur	Feldname	Kürzel	Codeliste	Ausgabeformate			
				Titel	Free	Short	Standard
Datenbank	DB			x	x	x	x
Titel	TI			x	x	x	x
Abstract	TX					x	x
Autor	AU			x	x	x	x
Institution	CO			x	x	x	x
Quelle	SO				x	x	x
Publikationscodes	SC				x	x	x
Konferenzangaben	CF				x	x	x
Sprache	LG	x				x	x
Standort	AV				x	x	x
Dokumentnummer	NO			x	x	x	x
Themenbehandlung	TC	x		x		x	x
Fachgebiete	CC			x		x	x
Notationen	X5	x					
Deskriptoren	DE			x		x	x
Thesaurus	X1						
Freie Begriffe	FT					x	x
Werkstoffbezeichnung	MT			x			x
Werkstoffindexierung	MI			x			x
Chemische Indexierung	CI			x			x
Dokumentart	PT	x					x
Titel der Quelle	TP	x	x				
Source notes (intern)	SN						
Erscheinungsjahr	YR	x	x		x		x

Eingabedatum	X9				
Update	UP	X	X	X	X

Suchhinweise

FIZ-Technik-WEB - Einfache Suche:

Ausfüllen des Suchformulars

- Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden.
- Die einzelnen Felder werden mit AND verknüpft und als eine einzige Suchanfrage an den Rechner übergeben. Je mehr Felder ausgefüllt werden, desto mehr wird das Suchergebnis präzisiert.
- In den Textfeldern (z.B. Suchbegriff, Titel, Autor, Institution oder Quelle) ist der Index-Einblick in das Wörterbuch möglich.
- In dieser Datenbank steht eine strukturierte Schlagwortliste (Thesaurus) für die Suche zur Verfügung.
- In den Feldern mit normierten Suchelementen ist die Auswahl der Suchbegriffe aus Listen möglich (z.B. Sprache, Fachgebiete, Dokumentart usw.)

FIZ-Technik-WEB - Erweiterte Suche

Im Suchfeld können beliebige Suchfragen unter Verwendung von Operatoren (z.B. AND, OR, NOT) eingegeben werden. Die maximale Länge einer Suchfrage darf 250 Zeichen nicht überschreiten. Suchschritte können durch Eingabe der laufenden Nummer mit Operatoren verknüpft werden (z.B. *1 and 2* sucht nach Dokumenten, die in Suchschritt 1 und Suchschritt 2 enthalten sind).

Aus der Feldliste kann ein Datenbankfeld ausgewählt werden, in dem gesucht werden soll. Wird z.B. Titel als Suchfeld gewählt, wird ausschließlich in diesem Feld und nicht in der ganzen Datenbank gesucht.

Bei der Suche in allen Feldern werden alle ggf. vorhandenen Synonyme, englische Benennungen und Unterbegriffe automatisch mit in die Suchfrage eingeschlossen.

Außerdem steht für eine präzisere Suche der Thesaurus Technik und Management online zur Verfügung und kann aus der Suchmaske aufgerufen werden.

Feld Autor (AU)

Der Autorenname wird automatisch am Ende mit \$ oder * maskiert, wenn er mindestens drei Zeichen umfasst (Eingabe z.B. Behrens oder Behrens- oder Behrens-H.).

Eine Liste aller Namen, die mit einer bestimmten Zeichenkette beginnen, kann mit dem Button "Index" aufgerufen werden. Um verschiedene Schreibweisen zu finden (z.B. Behrends) Eingabe: Behren "Index".

Feld Institution (CO)

Die Abkürzungen bei den Institutionen wurden aufgelöst zur besseren Such- und Lesbarkeit.

Feld Publikationscodes (SC)

Dieses Feld enthält ISBN, ISSN und CODEN - ISSN und ISBN sind ohne Vortext mit Bindestrich suchbar. Außerdem wurde die Konferenzfolgenummer (CSN), mit der man alle Konferenzen einer Serie aufrufen kann (ab 1993), und der FIZ-Technik-Zeitschriftencode (JC), der jeweils eine Zeitschrift eindeutig identifiziert, sichtbar und suchbar gemacht (z.B. CSN=00014 bzw. JC=0880).

Feld Konferenzangaben (CF)

Rückwirkend bis 1993 ergänzt: Feld für normierte Konferenzdaten. Vor 1993 wurden die Konferenzdaten nicht normiert erfasst. Die Abkürzungen sind jetzt ausgeschrieben.

Feld Standort (AV)

In diesem Feld befinden sich Links auf Volltexte (z.B. DOI - Digital Object Identifier) und die Signatur der TIB in Hannover. Dieses Feld ist nicht suchbar.

Feld Themenbehandlung (TC)

Dieses Feld ist seit 1993 belegt.

Feld Fachgebiete (X5)

Die oberste Ebene der Fachgebiete kann aufgeblättert werden. Bei der Suche werden alle hierarchisch darunter liegenden Fachgebiete automatisch mit in die Suche eingeschlossen. Die vollständige Fassung der neuen Fachordnung Technik 2006 kann unter <http://www.fiz-technik.de/download/fachordnung.pdf> abgerufen werden.

Außerdem sind in Feld X5 unter anderem Details zu erfassten Konferenzen suchbar (ab 1993):

Land der Institution, bei der der Autor arbeitet (ISO-Code) mit z.B. COC=DE oder COC=AT,

Land, in dem die Konferenz stattgefunden hat (ISO-Code) mit z.B. CFC=AT. Die Konferenzfolgenummer ist jetzt in Feld SC: Publikationscodes suchbar.

Feld Thesaurus (X1)

Bei der Suche mit Deskriptoren aus dem "Thesaurus Technik und Management" werden auch Dokumente gefunden, die deutsche oder englische Synonyme oder Unterbegriffe des Suchbegriffs enthalten. Im Feld X1 sind die Deskriptoren ohne Bindestriche und Gleichheitszeichen suchbar.

Empfohlen wird die Suche über den strukturierten Online-Thesaurus (via Button aus der Suchmaske).

Feld Freie Begriffe (FT)

Dieses Feld enthält nicht normierte Schlagwörter und ist ohne Bindestriche suchbar.

Feld Werkstoffbezeichnung (MT)

Die Bezeichnungen in diesem Feld müssen, soweit zutreffend, mit Bindestrich gesucht werden.

Feld Source Notes (SN)

Normierte Quellenangabe für den Link zum Vollext.

Datumsfelder

AN=Ladedatum der Datenbank (nicht suchbar)

X9=Eingabemonat des Dokumentes in die Datenbank, suchbar JJJJMM (Jahr, Monat)

Feld X9 wird nicht angezeigt ist aber suchbar (z.B. X9=200601)

UP=Aktualisierungsdatum der Datenbank, suchbar JJJJMMTT (Jahr, Monat, Tag)

YR=Erscheinungsjahr der genannten Veröffentlichung, suchbar JJJJ (Jahr)

Suche in mehreren Datenbanken

FIZ Technik übernimmt Referate aus der Datenbank INSPEC. Wird nach der Recherche in INSP auch noch in TEMA recherchiert, können diese Übernahmen ausgeschlossen werden, durch Verknüpfung des Suchergebnisses in TEMA mit NOT PD=INSP (z.B. 5 NOT PD=INSP >> der letzte Suchschritt, hier 5, wird eingeschränkt).

Suchhilfen

Zeitschriftenliste

<http://www.fiz-technik.de/download/journal-list-tema.pdf>

Klassifikation

Fachordnung Technik 2006, deutsch: <http://www.fiz-technik.de/download/fachordnung.pdf>

Liste der ausgewerteten Konferenzen

http://www/download/konf_prospekt_kurz.pdf

Feld Deskriptoren (DE)

Thesaurus Technik und Management (Ausgabe 2006), deutsch/englisch
Im FIZWEB online verfügbar.

Feld Sprache (LG)

Diese Liste umfasst nur die wichtigsten Codes:

BG	Bulgarisch	KO	Koreanisch	RO	Rumänisch
CH	Chinesisch	NL	Niederländisch	RU	Russisch
CS	Tschechisch	NO	Norwegisch	SK	Serbokroatisch
DA	Dänisch	PL	Polnisch	SN	Slowakisch
DE	Deutsch	PT	Portugiesisch	SH	Slowenisch
EN	Englisch	HU	Ungarisch	SP	Spanisch
FI	Finnisch	IT	Italienisch	SV	Schwedisch
FR	Französisch	JA	Japanisch		

Feld Dokumentart (PT)

B Buch

- BC - Buchkapitel
- BM - Monographie
- BN - Nachschlagewerk

C Konferenz

- CA - Konferenz-Einzelbericht
- CP - Konferenz-Gesamtbericht
- CS - Konferenz-Teilbericht

D Dissertation

- DD - Deutsche Dissertation
- DU - US-Dissertation
- DX - Andere Dissertation

E Elektronische Veröffentlichung

- EC - CD-ROM
- EI - Öffentliches Internet-Dokument
- EX - Weiteres Internet-Dokument

J Zeitschrift

- JL - Zeitschriftenaufsatz
- JS - Zeitschriftenkurzaufsatz

R Forschungsbericht

S Technische Regel

- SG - Richtlinie
- ST - Norm

Feld Themenbehandlung (TC)

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| A | Anwendungsspezifische
Abhandlung | N | Produktnachweis |
| E | Experimentelle Abhandlung | T | Theoretische
Abhandlung |
| G | Grundlegende Abhandlung | U | Überblick |
| H | Historische Abhandlung | W | Wirtschaftliche
Abhandlung |
| M | Managementaspekte | | |

**Stand der
Beschreibung:**

14.1.2008

© 2008 Fachinformationszentrum Technik e.V.